

Силабус навчальної дисципліни «Діагностика матеріалів і структур в електроніці. Частина 2»

№	Назва поля	Детальний контент, коментарі
1.	Назва факультету	Електронної та біомедичної інженерії
2.	Рівень вищої освіти	Освітньо-науковий
3.	Код і назва спеціальності	171 Електроніка
4.	Тип і назва освітньої програми	ОНП «Електроніка»
5.	Код і назва дисципліни (інформація з ЦІСТ)	Діагностика матеріалів і структур в електроніці
6.	Кількість ЄКТС кредитів	4
7.	Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)	Лекції – 30 год., практичні – 20 год., консультації – 6 год., самостійна робота – 64 год., сем. контроль – залік
8.	Графік (терміни) вивчення дисципліни	1 курс, 2 семестр
9.	Передумови для навчання за дисципліною	Математика. Фізика. Діагностика матеріалів і структур в електроніці. Частина 1
10.	Анотація (зміст) дисципліни	Вибіркова дисципліна зі спеціальності, містить змістові модулі: 1. Побудова статистичних моделей обробки експериментальних даних. 2. Адаптивні методи фільтрації даних. 3. Планування експерименту
11.	Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчання	Здатність застосовувати системні знання сучасних методів проведення досліджень у галузі електроніки та телекомунікації і в суміжних галузях. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел (у тому числі іншомовної літератури за фахом). Здатність використовувати сучасні програмні засоби до розв'язування задач аналізу даних
12.	Результати навчання здобувача вищої освіти	Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. Демонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі електроніки та телекомунікацій.
13.	Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену	Підсумковий модульний контроль з дисципліни передбачає залік. 1. Виконати завдання на практичних заняттях (кожне оцінюється від 3 до 5 балів, всього від 36 до 60 балів). 2. Виконати 2 контрольні роботи (кожна оцінюється від 6 до 10 балів, всього від 12 до 20 балів). 3. Виконати контрольне завдання згідно із заданим варіантом (оцінюється від 12 до 20 балів). Оцінка за семестр: $O_{\text{сем}} = (3 \dots 5) \times 12 \text{ ПЗ} + (6 \dots 10) \times 2 \text{ КР} + (12 \dots 20) \times 1 \text{ РГЗ} = (60 \dots 100) \text{ балів}$

14.	Якість освітнього процесу	Дотримання принципів академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми дисципліни – 2021 р. Практичні заняття забезпечено сучасним програмно-технічним забезпеченням, необхідними обчислювальними засобами
15.	Методичне забезпечення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Діагностика матеріалів і структур в електроніці» [Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. І.М.Бондаренко. – Харків, 2021. – 39 с. http://catalogue.nure.ua/knmz 2. Горячко А.М., Кулик С.П., Прокопенко О.В. Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії. Навч. посібник. Ч. 1. – К.: КНУ, 2011. – 133 с. 3. Горячко А.М., Кулик С.П., Прокопенко О.В. Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії. Навч. посібник. Ч. 2. – К.: КНУ, 2012. – 170 с.
16.	Розробник силабусу (посада, ПБ, ел. пошта)	Проф. каф. МЕЕПП О.В.Грицунов, д.ф.-м.н., професор. E-mail: alexander.gritsunov@nure.ua